



第41回 薄膜・表面物理セミナー(2013)

『放射光を用いた構造・電子状態解析の最前線： 硬 X 線光電子分光 (HAXPES) と X 線吸収微細構造 (XAFS)』 - 最先端解析手法により電子状態・反応挙動をみる -

放射光を用いた構造・電子状態解析の発展は目ざましく，中でも硬 X 線光電子分光法 (Hard X-ray Photoelectron Spectroscopy: HAXPES) では，高分解能・バルク敏感という特徴を活かし表面汚染の影響を低減させて物質の電子状態を精密に解析でき，さらに，埋もれた界面への適用や *in situ* 解析へも応用が広がっています。また，X 線吸収微細構造 (X-ray Absorption Fine Structure: XAFS) では，実用的な条件下での *in situ* 解析が飛躍的に進み，各種電池デバイスや環境触媒などの動作下・反応下における詳細な構造変化が解析できるようになってきました。本セミナーでは，HAXPES と XAFS に焦点を当て，第一線でご活躍されている講師の方々による最新の成果をご紹介します。多くの方々のご参加をお待ちしております。

日時：2013年8月6日(火) 13:00-17:00 (受付開始 12:30)、8月7日(水) 10:00-17:00 (受付開始 9:30)

場所：東工大田町キャンパス キャンパスイノベーションセンター 国際会議室

(東京都港区芝浦3-3-6, TEL03-3726-1111, JR線・田町駅下車 徒歩2分)

<http://www.cictokyo.jp/access.html> (アクセスマップ)

1. プログラム：

日時	講演題目	講師
8月6日(火)	13:00-14:00	HAXPES による燃料電池材料、半導体材料、酸化物薄膜の電子状態解析 尾嶋 正治 (東京大学)
	14:00-14:55	HAXPES 手法と応用 - 現状 BL47XU/SPring-8 光学、装置性能および深さ分析 - 池永 英司 (Spring-8)
	休憩 (15分)	
	15:10-16:05	HAXPES の実用表面分析への応用 - 「より内部」や「埋もれた界面」の非破壊分析 - 小川 慎吾 (東レリサーチセンター)
8月7日(水)	16:05-17:00	HAXPES の現状と今後の展望 小林 啓介 (広島大学)
	10:00-11:00	XAFS の現状と今後の進展 野村 昌治 (高エネ研)
	11:00-11:55	触媒などの固体試料における適切な XAFS 分析評価の実際 国須 正洋 (東レリサーチセンター)
	昼休憩 (65分)	
	13:00-13:55	XAFS によるリチウムイオン二次電池動作解析 内本 喜晴 (京都大学)
	13:55-14:50	時空間分解 XAFS の排ガス触媒・電池材料解析への応用 稲田 康宏 (立命館大学)
休憩 (20分)		
15:10-16:05	XAFS を用いた固体酸化物燃料電池材料・反応の <i>in situ</i> 解析 雨澤 浩史 (東北大学)	
16:05-17:00	軟 X 線波長分散 XAFS 法による表面化学反応リアルタイム追跡 雨宮 健太 (高エネ研)	

現在非会員の方でも，参加登録時に薄膜・表面物理分科会 (年会費A会員：3,000円，B会員：2,200円)にご入会いただければ，本セミナーより会員扱いとさせていただきます。

<http://www.jsap.or.jp/> より入会登録を行い，仮会員番号を取得後，本セミナーにお申込み下さい。

入会決定後，年会費請求書をお送りいたします。(年会費をセミナー参加費と同時に振込なさらないで下さい。)

***学生の場合は，会員・非会員の別を問いません。

3. 定員：80名 (満員になり次第締め切ります。)

4. 参加申込締切：2013年7月19日(金)

5. 参加申込方法：下記分科会ホームページ内の登録フォームにて参加登録してください。

<https://annex.jsap.or.jp/phpESP/public/survey.php?name=HakuhyouSeminar41>
参加登録完了後，下記銀行口座に参加費をご連絡いただいた期日までにお振込ください。原則として参加費の払い戻し，請求書の発行は致しません。領収書は当日会場にてお渡しいたします。

6. 参加費振込期限：2013年7月26日(金)

7. 参加費振込先：

三井住友銀行 本店営業部(本店でも可)

普通預金 口座番号：9474715

(社) 応用物理学会薄膜・表面物理分科会

(シヤ) オウヨウブツリガクカイハクマク・ヒョウモンブツリフンカカイ

8. セミナー内容問合せ先：

東北大学・高桑 雄二

TEL: 022-217-5365 FAX: 022-217-5405

E-Mail: takakuwa@tagen.tohoku.ac.jp

東レリサーチセンター 山元 隆志

TEL: 077-533-8615 FAX: 077-533-8628

E-Mail: Takashi.Yamamoto@trc.toray.co.jp

9. 参加登録問合せ先：

応用物理学会事務局分科会担当 上村 さつき

TEL: 03-5802-0863 FAX: 03-5802-6250

E-Mail: kamimura@jsap.or.jp

2. 参加費：テキスト代，消費税を含む。

薄膜・表面物理分科会会員*	応用物理学会会員**・協賛学協会会員	学生***	その他
2日間:15,000円 1日目のみ:8,000円 2日目のみ:12,000円	2日間:20,000円 1日目のみ:10,000円 2日目のみ:15,000円	2日間:7,000円 1日目のみ:3,000円 2日目のみ:5,000円	2日間:25,000円 1日目のみ:13,000円 2日目のみ:18,000円

*薄膜・表面物理分科会賛助会社の方は分科会会員扱いと致します。

**応用物理学会賛助会社の方は，応用物理学会会員扱いと致します。